



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 半导体芯片封装凸点缺陷检测技术研究

演讲人: 张滋黎 研究员 中国科学院微电子研究所

演讲摘要:

演讲大纲:

适合对象:

演讲人简介:

张滋黎，中国科学院微电子研究所研究员，博士生导师，中国科学院大学岗位教师，中国计量测试学会几何量专业委员会委员，中国计量测试学会在线检测技术与智能制造专业委员会委员，国家重点研发计划制造技术基础与关键部件重点专项评审专家，国家自然科学基金项目评议专家。2010年毕业于天津大学，获测试计量技术及仪器专业工学博士学位，主要从事精密仪器设计、光电测试技术、集成电路缺陷检测、计算机视觉和图像处理等方面的研究。先后公开发表论文 44 篇，其中 SCI 或 EI 检索 33 篇，申请专利 45 项（授权专利 26 项），登记软件著作权 9 项。作为项目负责人主持了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目，并参与了多项重大工程项目、国家自然基金、科技部重大专项、国家重点研发计划和中科院院装备等项目的研究。先后获得机械工业科学技术奖技术发明类特等奖 1 项和中国机械工业科学技术奖科技进步一等奖 1 项。